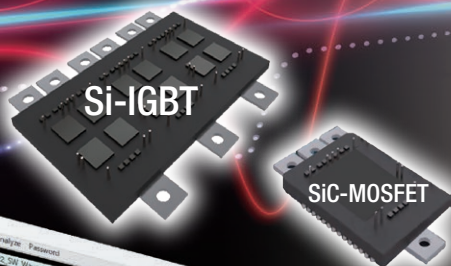




知りたい特性結果を瞬時に解析
R&Dから量産検査に!!

Instantly analyze the characteristic results!
High versatility from R&D
to mass production inspection!

Ultra-fast analysis



業務効率化/時間短縮

Work efficiency/Time reduction

1クリック2~3秒で全ての波形を表示

<※TDMS File時/データ容量で変化>

Display all waveforms 2~3 sec/1click

<※Depended on TDMS files/data capacity>

解析位置情報表示

Display location info of analysis target point
Vds, Ids, Vgs / VDS: td(on)/tr, td(off)/tf

複数File表示比較

Comparative display of multiple files

波形表示・白黒反転

Selectable waveform display between black and white inversion

NATS series

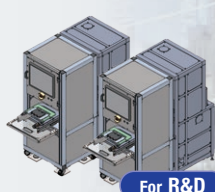
IGBT/SiC パワーモジュール
各種検査装置

Si-IGBT/SiC-MOSFET
Power Module Test System



For
Mass-Production

- LOADER接続イメージ
Loader type inspection system image
(Appearance varies depending on
system configuration)



For R&D

- 手動機外観イメージ
Manual inspection image

他社製テストデータの解析も可能

No.	モード Mode	機能 Main features
1	Waveform Analyze	任意のWaveファイルを指定。 任意の信号のグラフ表示および操作、カーソル表示、解析位置表示選択、ローカスグラフ表示。 Selectable any Wave files. Graph display and operation of any signal, cursor display, analysis position display selection, locus graph display.
2	P-N Stack View (+) (-)	任意のWaveファイルを指定。 検査対象モジュールよりPositiveまたはNegativeの重ね書きによる比較表示。 Selectable any Wave files. Comparative display by overwriting positive and negative from the target module.
3	Dual File View	MainとReferenceの2つのWaveファイルを指定。 2ファイルのグラフを重ね書きにより容易な比較表示が可能。 Selectable two wave files, Main and Reference. Easy comparative display by overwriting the both files.
4	Folder File View	MainのWaveファイルと任意のフォルダを指定。 Mainとフォルダ内のグラフを重ね書きにより容易な比較表示可能。 Selectable two wave files, Main and Reference. Easy comparative display by overwriting the both files.